Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio electrónico de barrido de filamento de tungsteno, SE, 300000x B2-01-35-163-7020

Código: B2-01-35-163-7020

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Especificaciones	B2-01-35-163-7020	B2-01-35-163-7032	B2-01-35-163-7050	
Resolución	3,9nm @20kV(SE) 4,5nm @20kV(BSE)	3nm @30kV(SE) 4nm @30kV(BSE) 8nm @3kV(SE)	1,0nm @15kV(SE) 1,5nm @1kV(SE) 0,8nm @30kV(STEM)	
Voltaje	0,5kV~20kV 30kV opcional	0,2kV~30kV	20V~ 30kV	
Aumento	1x~300,000x	1x~300,000x(película) 1x~1,000,000x(pantalla)	1x~ 2,500,000x	
Cañón de electrones	Filamento de tungsteno prealineado	Filamento de tungsteno prealineado	Cañón de electrones de emisión de campo Schottky, con desaceleración en cilindro, objetivo compuesto electromagnético, objetivo termostático refrigerado por agua	
Sistema de vacío	Vacío libre de aceite de control totalmente automático <5×10-4 Pa	Vacío libre de aceite de control totalmente automático <5×10-4 Pa Bajo vacío opcional 5~1000Pa	Vacío libre de aceite de control totalmente automático Cañón de electrones <9x10-8Pa Cámara de muestras <5x10-4Pa	
Bomba de vacío	Bomba mecánica×1, >200 L/min Bomba turbomolecular×1, > 240 L/S	Bomba mecánica×1, >200 L/min Bomba turbomolecular×1, > 240 L/S	Bomba mecánica×1, >6m3/h Bomba turbomolecular×1, > 240 L/S, Bomba iónica x2, >25L/s	
Platina de trabajo	Platina automática de 2 ejes, X:100 mm Y:100 mm	Platina automática de 5 ejes, X:120 mm Y:115 mm Z:50 mm T: -10° ~+90° R: 360° Opcional: platina automática de 3 ejes, B2-01-35-163-7032-A	Platina automática de 5 ejes, X:120 mm Y:115 mm Z:50 mm T: -10° ~+90° R: 360°	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cámara	CCD de navegación óptica vertical	CCD de navegación óptica vertical CCD de monitoreo horizontal	CCD de navegación óptica vertical CCD de monitoreo horizontal	□
Detector	Detector de electrones secundarios (ETD)	Detector de electrones secundarios (ETD)	Detector de electrones secundarios (ETD) Detector de electrones de ángulo alto Inlens	□
Software	Software de operación del SEM, idioma chino/inglés, visualización multicanal, navegación óptica, navegación por gestos, brillo y contraste automáticos, enfoque automático, astigmatismo automático, formato de imagen TIFF,JPG,BMP,PNG			□
Computador	Estación de trabajo, memoria 16G, disco duro 512G, monitor de 24", sistema Win10			□
Sala de instalación	Largo>3000 mm, ancho>4000mm, alto>2300 mm, temperatura 20~25 ℃, humedad<50%			□
Alimentación	CA 220 V(±10 %),50 Hz,2 kVA			□
□	Accesorios opcionales			N.º de catálogo
Opcional	BSE	BSE	BSE	B2-01-35-150-7051
	EDS	EDS	EDS	B2-01-35-150-7052
	-	EBSD	EBSD	B2-01-35-150-7053
	-	-	EDS+EBSD	B2-01-35-150-7054
	-	-	STEM, 9 cuadrantes, área total 80mm2	B2-01-35-150-7055
	-	-	EBIC	B2-01-35-150-7056
	-	-	CL	B2-01-35-150-7057
	-	-	Panel de control con perillas y trackball	B2-01-35-150-7058
	-	-	Almacén de intercambio de muestras	B2-01-35-150-7059
	-	-	Compuerta del haz y exposición por haz de electrones	B2-01-35-150-7060
	-	LVD, detector de bajo vacío	-	B2-01-35-150-7061
	-	Doble ánodo (emisión tetrodo)	-	B2-01-35-150-7062
	Filamento de tungsteno (6 unidades)	Filamento de tungsteno (6 unidades)	-	B2-01-35-150-7063
	Software de unión de imágenes de gran tamaño	Software de unión de imágenes de gran tamaño	Software de unión de imágenes de gran tamaño	B2-01-35-150-7070

Imágenes con información múltiple simultánea

El software de B2-01-35-163-7020 permite cambiar con un clic entre la imagen híbrida SE y BSE. La información de morfología y composición de las muestras puede observarse simultáneamente.

Imágenes multicanal

El detector está diseñado con gran precisión y es muy sensible. Adopta un diseño de 4 segmentos y puede obtener imágenes de sombras e imágenes de distribución de componentes en distintas direcciones sin inclinar la muestra.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen SE vs. imagen BSE

En el modo de imagen BSE, el efecto de carga se reduce notablemente y se puede obtener más información de composición de la superficie de la muestra.

Instrumentos de preparación de muestras para microscopio electrónico de barrido		
B2-01-35-150-7038Máquina de fresado (pulido), grabado y pulverización por haz de iones	**B2-01-35-150-7039Máquina de grabado, pulido y adelgazamiento por haz de iones**	**B2-01-35-150-7080Ultramicrótomo**

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-163-7020**			
Otras especificaciones	Bomba turbomolecular 240L/S, bomba mecánica 12m3/H			
Accesorio opcional	B2-01-35-150-7001 BSE B2-01-35-150-7002 EDS B2-01-35-150-7011 Recubridor iónico por pulverización catódica			
Sistema compatible	Win10			
Luz transmitida	Cartucho de filamento de tungsteno, voltaje 1~30KV			
Platina de trabajo	Platina manual de 3 ejes X/Y/R, diámetro máx. de muestra 370mm, altura máx. 68mm			
Desplazamiento de la platina de trabajo	100x100x60mm			
Tamaño de la platina de trabajo	Platina automática estándar de 3 ejes			
Tipo de platina de trabajo	Platina motorizada			
Objetivo	Detector SE+CCD			
Aumento estándar	1x~300000x			
Características	Platina motorizada			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización